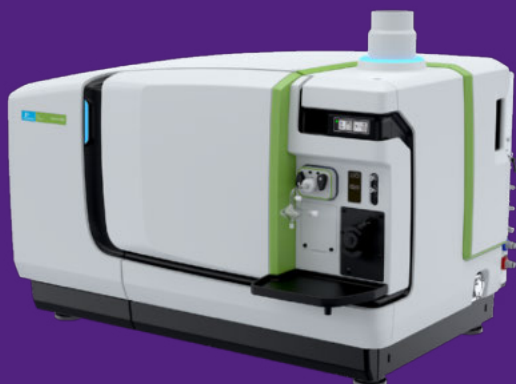


ساپای‌ال سی آی سی اف ای تی سی اوانت اینوو اقای اس

طیف سنجی جرمی ICP

نکس ایون® مشخصات نصب ICP-MS چند قطبی 5000



عملکرد زیر برای هر دستگاه تولید شده و در محل نصب با استفاده از مواد شیمیایی ارائه شده همراه دستگاه تضمین می شود.

محدودیت های تشخیص

براساس سه برابر انحراف معیار نمونه ی شاهد با استفاده از زمان انتگرال گیری سه ثانیه ای و پرش پیک در یک نقطه به ازای هر جرم.

عنصر	محدودیت های تشخیص (ng/L) (ppt)
۹بش	0.5 >
۳۱پ	20 >
۱۳۳اس*	50 >
۵۲کروم	0.7 > (حالت واکنش، با آمونیاک در اتاق تمیز)
۵۵آهن	0.7 > (حالت واکنش با آمونیاک در اتاق تمیز)
۱۱۵در	0.1 >
۲۳۸یو	0.1 >

حساسیت

عنصر	حساسیت مک پس/(میلی گرم/لیتر)
۹بش	15 <
۱۱۵در	۵۰۰ <
۲۳۸یو	300 <
۵۶(حالت واکنش با آمونیاک) Fe	۲۵۰ <

گونه های اکسید

اندازه گیری شده تحت شرایط عملیاتی یکسان برای دستیابی به مشخصات حساسیت و حد تشخیص.

مدیرعامل، آسی

> 0.03

دقت کوتاه مدت

به عنوان انحراف معیار نسبی (RSD %) سیگنال (شش تکرار در هر جرم) برای یک محلول چند عنصری 1-0.2 میکروگرم در لیتر (ppb) با استفاده از روش حالت ترکیبی با زمان ادغام سه ثانیه تعریف شده است.

>3% RSD

ثبات بلندمدت

پس از یک دوره گرم شدن یک ساعته اندازه گیری شد. به عنوان انحراف معیار نسبی سیگنال میانگین برای یک محلول چند عنصری 1-0.2 میکروگرم در لیتر (ppb) تعریف می شود، با استفاده از روش حالت ترکیبی و چرخش خودکار بین حالت های استاندارد و واکنش، هر 10 دقیقه یک بار (شش اندازه گیری تکراری در هر جرم) بدون استانداردسازی داخلی و با حداکثر سرعت تغییر حالت اندازه گیری می شود.

کمتر از 4% RSD طی چهار ساعت

دقت نسبت ایزوتوپ

تعریف شده برای نسبت ایزوتوپی $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ با استفاده از پرش پیک تک نقطه ای بدست آمده است. Ag.

> 0.08% RSD یا در ضریب دو از حد مجاز آمار شمارش*)

پایداری کالیبراسیون جرم

با استفاده از محلول چند عنصری 0.2 میکروگرم در لیتر (ppb) حاوی ^{13}C ، ^{15}N ، ^{18}O و ^{29}Si ، بر حسب تغییر در موقعیت طیفی مربوط به حداکثر شدت پیک طیفی برای هر عنصر تعریف می شود، که بدون استفاده از الگوریتم های جستجوی پیک چند نقطه ای به دست می آید. U.

در هشت ساعت کار مداوم 0.05 amu >

سرعت جهش اوج چهارقطبی (Slew)

به عنوان حداکثر نرخ تعریف می شود که در آن چهارقطبی می تواند بدون تأثیر بر دقت اندازه گیری تحلیلی، از ۱۶۰ amu عبور کند.

۶ میلی آمپر بر ثانیه*

سرعت اسکن چهارقطبی

به عنوان حداکثر نرخ تعریف می شود که در آن می توان چهارقطبی را اسکن کرد و در عین حال داده های طیفی پیوسته را در هر جرم از حداقل تا حداکثر جرم دستگاه (1-285 amu) با 20 نقطه داده در هر amu به دست آورد.

۵۰۰۰ آمپر بر ثانیه*

محدوده خطی آشکارساز

سیمولاسکن سیستم تشخیص از > 0.1 cps تا < 10^۹ cps. محدوده دینامیکی خطی می تواند تا 12 مرتبه بزرگی افزایش یابد، EDR این امر بیش از 10 مرتبه بزرگی محدوده دینامیکی خطی را در یک اسکن پیوسته فراهم می کند. با استفاده از قابلیت cps.

سرعت جمع آوری داده های گذرا

اندازه گیری شده در حالت عملکرد عادی (غیر نانوحالت).

حداکثر ۳۰۰۰ نقطه داده زمانی در ثانیه*

حساسیت فراوانی

حساسیت فراوانی با افزایش جرم کاهش می یابد. بنابراین، برای ICP-MS NexION 5000، حساسیت فراوانی در بالاترین ایزوتوپ طبیعی اندازه گیری می شود، ^{238}U .

به لطف طراحی نوین NexION 5000، این سیستم ۸۰۰۰ حساسیت فراوانی در حالت تک چهارگانه.

در حالت MS/MS، حساسیت فراوانی بسیار فراتر از محدوده دینامیکی آشکارساز (10 است) و بنابراین مشخصات عملکرد حساسیت فراوانی تضمین شده برای NexION 5000 در حالت MS/MS برابر با 10 است. ^{10}B .

نیمه S2/S8

طراحی شده برای ارتقاء (با کیت های اختیاری) تا دستورالعمل های S2 برای الزامات ایمنی و الکتریکی و S8 برای ارگونومی مهندسی نیمه هادی را برآورده کند. این ممکن است شامل قفل های ایمنی، خاموش شدن اضطراری، محافظت در برابر آتش و مهارهای لرزه ای در صورت زلزله باشد.

* نشان دهنده اندازه گیری فقط در کارخانه است.



شرکت پرکین المر

خیابان وینتر، پلاک ۹۴۰
والتام، ماساچوست 02451 ایالات متحده
آمریکان: (800) 400-762 یا (۱۰)
4602-925-203
www.perkinelmer.com

برای مشاهده فهرست کامل دفاتر جهانی ما، به www.perkinelmer.com/ContactUs مراجعه کنید.

کپی رایت © 2020، شرکت PerkinElmer. تمامی حقوق محفوظ است. PerkinElmer یک علامت تجاری ثبت شده PerkinElmer, Inc. است. سایر علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشند.

رسمت انگلیس عمومی

۶۸۵۲۶۰۵۲۳۳۸۴